

**NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD**

**CEI
IEC
748-4-2**

QC 790304

Première édition
First edition
1993-11

**Dispositifs à semiconducteurs –
Circuits intégrés –**

Partie 4:

Circuits intégrés d'interface –

Section 2: Spécification particulière cadre pour les
convertisseurs linéaires analogiques-numériques

**Semiconductor devices –
Integrated circuits –**

Part 4:

Interface integrated circuits –

Section 2: Blank detail specification for linear
analogue-to-digital converters (ADC)



Numéro de référence
Reference number
CEI/IEC 748-4-2: 1993

Numéros des publications

Depuis le 1^{er} janvier 1997, les publications de la CEI sont numérotées à partir de 60 000.

Publications consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de la CEI incorporant les amendements sont disponibles. Par exemple, les numéros d'édition 1.0, 1.1 et 1.2 indiquent respectivement la publication de base, la publication de base incorporant l'amendement 1, et la publication de base incorporant les amendements 1 et 2.

Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est constamment revu par la CEI afin qu'il reflète l'état actuel de la technique.

Des renseignements relatifs à la date de reconfirmation de la publication sont disponibles dans le Catalogue de la CEI.

Les renseignements relatifs à des questions à l'étude et des travaux en cours entrepris par le comité technique qui a établi cette publication, ainsi que la liste des publications établies, se trouvent dans les documents ci-dessous:

- «Site web» de la CEI*
- **Catalogue des publications de la CEI**
Publié annuellement et mis à jour régulièrement (Catalogue en ligne)*
- **Bulletin de la CEI**
Disponible à la fois au «site web» de la CEI* et comme périodique imprimé

Terminologie, symboles graphiques et littéraux

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se reportera à la CEI 60050: *Vocabulaire Electrotechnique International* (VEI).

Pour les symboles graphiques, les symboles littéraux et les signes d'usage général approuvés par la CEI, le lecteur consultera la CEI 60027: *Symboles littéraux à utiliser en électrotechnique*, la CEI 60417: *Symboles graphiques utilisables sur le matériel. Index, relevé et compilation des feuilles individuelles*, et la CEI 60617: *Symboles graphiques pour schémas*.

* Voir adresse «site web» sur la page de titre.

Numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are issued with a designation in the 60 000 series.

Consolidated publications

Consolidated versions of some IEC publications including amendments are available. For example, edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to the base publication, the base publication incorporating amendment 1 and the base publication incorporating amendments 1 and 2.

Validity of this publication

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC, thus ensuring that the content reflects current technology.

Information relating to the date of the reconfirmation of the publication is available in the IEC catalogue.

Information on the subjects under consideration and work in progress undertaken by the technical committee which has prepared this publication, as well as the list of publications issued, is to be found at the following IEC sources:

- **IEC web site***
- **Catalogue of IEC publications**
Published yearly with regular updates (On-line catalogue)*
- **IEC Bulletin**
Available both at the IEC web site* and as a printed periodical

Terminology, graphical and letter symbols

For general terminology, readers are referred to IEC 60050: *International Electrotechnical Vocabulary* (IEV).

For graphical symbols, and letter symbols and signs approved by the IEC for general use, readers are referred to publications IEC 60027: *Letter symbols to be used in electrical technology*, IEC 60417: *Graphical symbols for use on equipment. Index, survey and compilation of the single sheets* and IEC 60617: *Graphical symbols for diagrams*.

* See web site address on title page.

NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD

CEI
IEC
748-4-2

QC 790304

Première édition
First edition
1993-11

**Dispositifs à semiconducteurs –
Circuits intégrés –**

Partie 4:

Circuits intégrés d'interface –

Section 2: Spécification particulière cadre pour les
convertisseurs linéaires analogiques-numériques

**Semiconductor devices –
Integrated circuits –**

Part 4:

Interface integrated circuits –

Section 2: Blank detail specification for linear
analogue-to-digital converters (ADC)

© CEI 1993 Droits de reproduction réservés — Copyright — all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni
utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun pro-
cédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et
les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in
any form or by any means, electronic or mechanical,
including photocopying and microfilm, without permission
in writing from the publisher.

Bureau Central de la Commission Electrotechnique Internationale 3, rue de Varembe Genève, Suisse



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX
PRICE CODE

R

Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue

AVA Documents
Document Sharing Hub

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DISPOSITIFS À SEMICONDUCTEURS –
Circuits intégrés –Partie 4: Circuits intégrés d'interface –
Section 2: Spécification particulière cadre pour
les convertisseurs linéaires analogiques-numériques

AVANT-PROPOS

- 1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes internationales. Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par les comités d'études où sont représentés tous les Comités nationaux s'intéressant à ces questions, expriment dans la plus grande mesure possible un accord international sur les sujets examinés.
- 3) Ces décisions constituent des recommandations internationales 2publiées sous forme de normes, de rapports techniques ou de guides et agréées comme telles par les Comités nationaux.
- 4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent à appliquer de façon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEI dans leurs normes nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEI et la norme nationale ou régionale correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière.

La Norme internationale 748-4-2 a été établie par le sous-comité 47A: Circuits intégrés, du comité d'études 47 de la CEI: Dispositifs à semiconducteurs.

Cette norme est une spécification particulière cadre pour les convertisseurs linéaires analogique-numérique dans le domaine du système CEI d'assurance de la qualité des composants électroniques (IECQ).

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

Règle des Six Mois	Rapport de vote
47A(BC)271	47A(BC)282

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

**SEMICONDUCTOR DEVICES –
Integrated circuits –****Part 4: Interface integrated circuits –
Section 2: Blank detail specification for
linear analogue-to-digital converters (ADC)**

FOREWORD

- 1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote international cooperation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by technical committees on which all the National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the subjects dealt with.
- 3) They have the form of recommendations for international use published in the form of standards, technical reports or guides and they are accepted by the National Committees in that sense.
- 4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly indicated in the latter.

International Standard IEC 748-4-2 has been prepared by sub-committee 47A: Integrated circuits, of IEC technical committee 47: Semiconductor devices.

This standard is a blank detail specification for analogue-to-digital converters (ADC) in the field of the IEC Quality Assessment for Electronic Components (IECQ).

The text of this standard is based on the following documents:

Six Months' Rule	Report on voting
47A(CO)271	47A(CO)282

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

Le numéro QC qui figure sur la page de couverture de la présente publication est le numéro de la spécification dans le système CEI d'assurance de la qualité des composants électroniques (IECQ).

Les publications suivantes de la CEI sont citées dans la présente norme:

- | | |
|----------------------|---|
| CEI 68-2-17: 1978, | <i>Essais d'environnement – Deuxième partie: Essais – Essai Q: Étanchéité</i>
Amendement 4 (1991) |
| CEI 747-1: 1983, | <i>Dispositifs à semiconducteurs – Dispositifs discrets et circuits intégrés – Première partie: Généralités</i> |
| CEI 747-10: 1991, | <i>Dispositifs à semiconducteurs – Dispositifs discrets et circuits intégrés – Dixième partie: Spécification générique pour les dispositifs discrets et les circuits intégrés</i> |
| CEI 748-1: 1984, | <i>Dispositifs à semiconducteurs – Circuits intégrés – Première partie: Généralités</i>
Amendement 1 (1991) |
| CEI 748-4: 1987, | <i>Dispositifs à semiconducteurs – Circuits intégrés – Quatrième partie: Circuits intégrés d'interface</i>
Amendement 1 (1991) |
| CEI 748-11: 1990, | <i>Dispositifs à semiconducteurs – Circuits intégrés – Onzième partie: Spécification intermédiaire pour les circuits intégrés à semiconducteurs à l'exclusion des circuits hybrides</i> |
| CEI 749:1984, | <i>Dispositifs à semiconducteurs – Essais mécaniques et climatiques</i>
Amendement 1 (1991) |
| CEI QC 001002: 1986, | <i>Règles de procédure du système CEI d'assurance de la qualité des composants électroniques (IECQ)</i>
Amendement 1 (1992) |

The QC number that appears on the front cover of this publication is the specification number in the IEC Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ).

The following IEC publications are quoted in this standard:

- | | |
|----------------------|---|
| IEC 68-2-17: 1978, | <i>Environmental testing – Part 2: Tests – Test Q: Sealing</i>
Amendment 4 (1991) |
| IEC 747-1: 1983, | <i>Semiconductor devices – Discrete devices and integrated circuits – Part 1: General</i> |
| IEC 747-10: 1991, | <i>Semiconductor devices – Discrete devices and integrated circuits – Part 10: Generic specification for discrete devices and integrated circuits</i> |
| IEC 748-1: 1984, | <i>Semiconductor devices – Integrated circuits – Part 1: General</i>
Amendment 1 (1991) |
| IEC 748-4: 1987, | <i>Semiconductor devices – Integrated circuits – Part 4: Interface integrated circuits</i>
Amendment 1 (1991) |
| IEC 748-11: 1990, | <i>Semiconductor devices – Integrated circuits – Part 11: Sectional specification for semiconductor integrated circuits excluding hybrid circuits</i> |
| IEC 749:1984, | <i>Semiconductor devices – Mechanical and climatic test methods</i>
Amendment 1 (1991) |
| IEC QC 001002: 1986, | <i>Rules of procedure of the IEC Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ)</i>
Amendment 1 (1992) |

DISPOSITIFS À SEMICONDUCTEURS – Circuits intégrés –

Partie 4: Circuits intégrés d'interface – Section 2: Spécification particulière cadre pour les convertisseurs linéaires analogiques-numériques

INTRODUCTION

Le système CEI d'assurance de la qualité des composants électroniques fonctionne conformément aux statuts de la CEI et sous son autorité. Le but de ce système est de définir les procédures d'assurance de la qualité de telle façon que les composants électroniques livrés par un pays participant comme étant conformes aux exigences d'une spécification applicable soient également acceptables dans les autres pays participants sans nécessiter d'autres essais.

Cette spécification particulière cadre fait partie d'une série de spécifications particulières cadres concernant les dispositifs à semiconducteurs; elle doit être utilisée avec les publications suivantes de la CEI:

747-10/QC 700000: Dispositifs à semiconducteurs – Dispositifs discrets et circuits intégrés – Dixième partie: Spécification générique pour les dispositifs discrets et les circuits intégrés.

748-11/QC 790100: Dispositifs à semiconducteurs – Circuits intégrés – Onzième partie: Spécification intermédiaire pour les circuits intégrés à semiconducteurs à l'exclusion des hybrides.

Renseignements nécessaires

Les nombres placés entre crochets sur cette page et les pages suivantes correspondent aux indications suivantes qui doivent être portées dans les cases prévues à cet effet.

Identification de la spécification particulière

- [1] Nom de l'Organisme National de Normalisation sous l'autorité duquel la spécification particulière est établie.
- [2] Numéro IECQ de la spécification particulière.
- [3] Numéros de référence et d'édition des spécifications générique et intermédiaire.
- [4] Numéro national de la spécification particulière, date d'édition et toute autre information requise par le système national.

Identification du composant

- [5] Fonction principale et numéro de type.
- [6] Renseignements sur la construction typique (matériaux, technologie principale) et le boîtier. Si le dispositif a plusieurs types de produits dérivés, il convient d'indiquer les différences, par exemple les particularités des caractéristiques dans le tableau comparatif.
Pour les dispositifs sensibles aux charges électrostatiques, les précautions nécessaires à observer doivent être ajoutées dans la spécification particulière.

SEMICONDUCTOR DEVICES – Integrated circuits –

Part 4: Interface integrated circuits – Section 2: Blank detail specification for linear analogue-to-digital converters (ADC)

INTRODUCTION

The IEC Quality Assessment System for Electronic Components is operated in accordance with the statutes of the IEC and under the authority of the IEC. The object of this system is to define quality assessment procedures in such a manner that electronic components released by one participating country as conforming with the requirements of an applicable specification are equally acceptable in all other participating countries without the need for further testing.

This blank detail specification is one of a series of blank detail specifications for semiconductor devices and shall be used with the following IEC Publications:

747-10/QC 700000: Semiconductor devices – Discrete devices and integrated circuits – Part 10: Generic specification for discrete devices and integrated circuits.

748-11/QC 790100: Semiconductor devices – Integrated circuits – Part 11: Sectional specification for semiconductor integrated circuits excluding hybrid circuits.

Required information

Numbers shown in brackets on this and the following pages correspond to the following items of required information, which should be entered in the spaces provided.

Identification of the detail specification

- [1] The name of the National Standards Organization under whose authority the detail specification is issued.
- [2] The IECQ number of the detail specification.
- [3] The numbers and issue numbers of the generic and sectional specifications.
- [4] The national number of the detail specification, date of issue and any further information, if required by the national system.

Identification of the component

- [5] Main function and type number.
- [6] Information on typical construction (materials, the main technology) and the package. If the device has several kinds of derivative products, those differences should be indicated, e.g. features of the characteristics in the comparison table. If the device is electrostatic sensitive, a caution statement shall be added in the detail specification.

- [7] Dessin d'encombrement, identification des bornes, marquage et/ou référence aux documents correspondants pour les encombrements.
- [8] Catégorie d'assurance de la qualité selon 2.6 de la spécification générique.
- [9] Données de référence.

[Dans toute cette norme, les textes indiqués entre crochets, sont destinés à guider le rédacteur de la spécification; ils ne doivent pas figurer dans la spécification particulière.]

[Lorsqu'il existe un risque d'ambiguïté quant à savoir si un paragraphe est uniquement destiné à guider le rédacteur ou non, il doit être indiqué entre crochets.]

[Nom (adresse) de l'ONH responsable (et éventuellement de l'organisme auprès duquel la spécification peut être obtenue).] [1]	[N° de la spécification particulière IECQ, plus n° d'édition et/ou date.] [2] QC 790304
COMPOSANT ÉLECTRONIQUE DE QUALITÉ CONTRÔLÉE CONFORMÉMENT À: Spécification générique: Publication 747-10/QC 700000 Spécification intermédiaire: Publication 748-11/QC 790100 [et références nationales si elles sont différentes]. [3]	[Numéro national de la spécification particulière.] [4] [Cette case n'a pas besoin d'être utilisée si le numéro national est identique au numéro IECQ.]
SPÉCIFICATION PARTICULIÈRE CADRE POUR: LES CONVERTISSEURS LINÉAIRES ANALOGIQUE-NUMÉRIQUE [5] [Numéro(s) de type du ou des dispositifs.] Renseignements à donner dans les commandes: voir le paragraphe 1.2 de cette norme.	
Description mécanique [7] <i>Références d'encombrement:</i> [Référence du boîtier normalisé, numéro CEI (obligatoire si disponible) et/ou numéro national.] <i>Dessin d'encombrement</i> [peut être transféré, ou donné avec plus de détails, à l'article 8 de cette norme]. <i>Identification des bornes</i> [dessin indiquant l'emplacement des bornes, y compris les symboles graphiques]. <i>Marquage:</i> [lettres et chiffres, ou code de couleur]. [La spécification particulière doit indiquer les informations à marquer sur le dispositif.] [Voir le paragraphe 2.5 de la spécification générique et/ou le paragraphe 1.1 de cette norme.]	Brève description [6] Application: Fonction: Construction typique: [Si, monolithique, bipolaire, MOS.] Encapsulation: [avec ou sans cavité.] [Tableau comparatif des caractéristiques des différents produits.] ATTENTION: Dispositifs sensibles aux charges électrostatiques.
	Catégories d'assurance de la qualité [8] [A choisir dans le paragraphe 2.6 de la spécification générique.]
	Données de référence [9] [Données de référence sur les propriétés les plus importantes pour permettre la comparaison des types de composants entre eux.]
Se reporter à la Liste des produits homologués en vigueur pour connaître les fabricants dont les composants conformes à cette spécification particulière sont homologués.	

- [7] Outline drawing, terminal identification, marking and/or reference to the relevant document for outlines.
- [8] Category of assessed quality according to 2.6 of the generic specification.
- [9] Reference data.

[Throughout this standard, the texts given in square brackets are intended for guidance to the specification writer and shall not be included in the detail specification.]

[When confusion may arise as to whether a paragraph is only instruction to the writer or not, the paragraph shall be indicated between brackets.]

[Name (address) of responsible NAI (and possibly of the body from which the specification is available).] [1]	[Number of IECQ detail specification, plus issue number and/or date.] [2] QC 790304
ELECTRONIC COMPONENT OF ASSESSED QUALITY IN ACCORDANCE WITH: Generic specification: Publication 747-10/QC 700000 Sectional specification: Publication 748-11/QC 790100 [and national references if different.] [3]	[National number of detail specification.] [4] [This box need not be used if the national number repeats the IECQ number.]
BLANK DETAIL SPECIFICATION FOR: LINEAR ANALOGUE-TO-DIGITAL CONVERTERS (ADC) [5] [Type number(s) of the relevant device(s).] Ordering information: see subclause 1.2 of this standard.	
Mechanical description [7] <i>Outline references:</i> [Standard package reference should be given, IEC number (mandatory if available) and/or national number.] <i>Outline drawing</i> [may be transferred to or given with more details in clause 8 of this standard]. <i>Terminal identification</i> [drawing showing pin assignments, including graphical symbols]. <i>Marking:</i> [letters and figures, or colour code]. [The detail specification shall prescribe the information to be marked on the device, if any.] [See subclause 2.5 of the generic specification and/or subclause 1.1 of this standard.]	Short description [6] Application: Function: Typical construction: [Si, monolithic, bipolar, MOS.] Encapsulation: [cavity or non-cavity.] [Comparison table of characteristics for variant products.] CAUTION: Electrostatic sensitive devices.
	Categories of assessed quality [8] [From subclause 2.6 of the generic specification.]
	Reference data [9] [Reference data on the most important properties to permit comparison between types.]
Information about manufacturers who have components qualified to this detail specification is available in the current Qualified Products List.	

1 Marquage et renseignements à donner dans les commandes

1.1 Marquage

Se reporter à 2.5 de la spécification générique.

La spécification particulière doit indiquer les renseignements à marquer relatifs aux types, tels que lettres, chiffres et/ou codes.

Lorsque le marquage inclut des renseignements autres que ceux qui sont spécifiés en 2.5 de la spécification générique, par exemple des renseignements réservés à l'usage interne du fabricant, ces renseignements doivent être différenciés.

Si tous les renseignements sont déjà indiqués dans la case [7] sur la première page, ceci doit être indiqué.

1.2 Renseignements à donner dans les commandes

Sauf spécification contraire, les renseignements suivants constituent le minimum nécessaire pour passer commande d'un dispositif donné:

- référence précise du modèle (et valeur de la tension nominale, si nécessaire);
- référence IECQ de la spécification particulière avec numéro d'édition et/ou date selon le cas;
- catégorie d'assurance de la qualité définie à l'article 9 de la spécification intermédiaire et, si nécessaire, séquence de sélection définie à l'article 8 de cette même spécification;
- emballage pour la livraison;
- toute autre particularité.

2 Description relative à l'application du dispositif

Les renseignements relatifs à l'application du dispositif dans les équipements ou circuits et à ses relations avec les dispositifs associés doivent être donnés ici. Le texte dépendra de la fonction à décrire.

3 Spécification de la fonction

Un schéma synoptique détaillé du circuit intégré, ou toute autre information équivalente sur le circuit intégré doit être donné, si nécessaire.

4 Valeurs limites (système des valeurs limites absolues)

Cet article n'est pas applicable aux exigences de contrôle.

Ces valeurs s'appliquent dans la gamme des températures de fonctionnement, sauf spécification contraire.

1 Marking and ordering information

1.1 Marking

See 2.5 of the generic specification.

The detail specification shall prescribe the information marked for the relevant types, such as letters, figures and/or codes.

When the marking contains information other than that specified in 2.5 of the generic specification, such as that used for the manufacturer's internal use, it shall be distinguished.

If all the information has already appeared in box [7] of the front page, this shall be indicated.

1.2 Ordering information

The following minimum information is necessary to order a specific device, unless otherwise specified:

- precise type reference (and nominal voltage value, if required);
- IECQ reference of detail specification with issue number and/or date when relevant;
- category of assessed quality as defined in clause 9 of the sectional specification and, if required, screening sequence as defined in clause 8 of sectional specification;
- packaging for delivery;
- any other particulars.

2 Application related description

Information on the application of the device in equipment or circuits and its relations to the associated devices shall be given here. The contents will depend on the function to be described.

3 Specification of the function

A detailed block diagram or equivalent circuit information of the integrated circuit shall be given, if necessary.

4 Limiting values (absolute maximum rating system)

This clause is not for inspection purposes.

These values apply over the operating temperature range, unless otherwise specified.

Les conditions limites mécaniques ou d'environnement particulières au dispositif et toute interdépendance de ces conditions limites doivent être précisées ici.

Les courbes doivent de préférence figurer à l'article 9 de la spécification particulière.

Para- graphe	Paramètres*	Symbole	Valeurs		
			Min.	Max.	Unité
4.1	Tension d'alimentation (voir note de l'article 5 de la présente spécification)	V_{CC} V_{EE}	x x	x x	V X
4.2	Courants d'alimentation (s'il y a lieu)	I_{CC} I_{EE}	x x	x x	mA mA
4.3.1	Tension(s) d'entrée(s) analogique	$V_{I(A)}$	x	x	V
4.3.2	Tension d'entrée de référence (s'il y a lieu)	V_{REF}		x	V
4.3.3	Tension différentielle de référence (s'il y a lieu)	$V_{REF(D)}$		x	V
4.3.4	Tension d'entrées des commandes numériques	$V_{I(D)}$	x	x	V
4.4	Tensions applicables sur les sorties numériques	V_O	x	x	V
4.5	Courant(s) d'entrée de référence (si approprié)	I_{REF}		x	mA
4.6	Courant(s) aux sorties numériques (s'il y a lieu)	I_O	x	x	mA
4.7	Autres tensions et/ou courants de bornes			x	V et/ou mA
4.8	Dissipation de puissance	P_{tot}		x	W
4.9	Courant de court-circuit en sortie	I_{OS}		x	mA
4.10	Durée du court-circuit en sortie (s'il y a lieu)	t_{OS}		x	s
* Voir CEI 748-1, Amendement 1, chapitre VI, notes 1 et 2 en 10.4.1.					
Para- graphe	Paramètres des valeurs limites de températures**	Symbole	Valeurs		Unité
			Min.	Max.	
4.11	Température de fonctionnement	T_{amb}	x	x	°C
4.12	Température de stockage	T_{stg}	x	x	°C
** Voir CEI 748-1, Amendement 1, chapitre VI, note en 10.4.2.					

5 Conditions de fonctionnement (dans la gamme des températures de fonctionnement spécifiées)

Les conditions de fonctionnement sont spécifiées dans les méthodes de mesure correspondantes (voir la CEI 748-4, chapitre IV, section trois, catégorie II).

Voir 13.3 de cette norme pour les exigences de contrôle.

Conditions générales de mesures et valeurs correspondantes:

5.1	Tensions d'alimentation [voir la note]	V_{CC}	V_{EE}
5.2	Courants d'alimentation	I_{CC}	I_{EE}